

Optisk 3D-måling i produktionslinien!

26 maj i København

Velkommen til en heldagsseminarium

Den 26/5 inviterer Parameter AB og SICK A/S ind til en hel dag, som tager udgangspunkt i teknikker, muligheder og implementering af kvalitetssikring ved hjælp af optisk måleteknik indenfor industrien (Vision).

Udviklingen går stærk, processorkraften øges og der kommer hele tiden forbedrede teknikker som åbner for nye anvendelsesmuligheder og giver dig nye muligheder til øget produktivitet.

Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at orientere dig inden for dette spændende område. Du får en unik mulighed for, at lytte til interessante foredrag fra markedets ledende producenter og systemintegratører og du bliver informeret om hvordan teknikken i praksis anvendes i industrien.

Tid og sted

26 maj 2009
9.00-16.30
Park Inn Copenhagen Airport
Engvej 171, København S
www.parkinn.com

Pris

DKK 475.-/person.
Kaffe og frokost er inkl.

Tilmelding

På vores hjemmeside www.parameter.se
eller via e-mail til fia@parameter.se

OBS! Sidste tilmeldingsfrist er år 15/5 2008

Program

Tid	Emne
09.00-10.00	Registrering - Kaffe og morgenmad
10.00-10.30	Overview over optical 3D measurement methods / Tjark Nikolai, MVTec
10.30-11.00	A palette of software tools for 3D / Tjark Nikolai, MVTec
11.00-11.30	Kaffe
11.30-12.00	How to choose a laser for maximum accuracy and safety / Konrad Wozniak, Parameter AB
12.00-12.30	Sensors and illumination – possibilities and limitations for 3D Machine Vision Gustav von Heijne, Parameter AB
12.30-14.00	Frokost
14.00-14.20	Triangulation applications in industry / John Grøndahl, SICK A/S
14.20-14.40	3D for Braille Inspection in pharmaceutical industry / Erling Wessberg, Soft Design AB
14.40-15.00	Industrial 3D Bin Picking using SCAPE software / Asim Ikram, Scape Technologies
15.00-15.30	Kaffe
15.30-16.00	Rapid matching and quantification of tolerances on scanned surfaces / Josep Forest, AQ Sense
16.00-16.30	Conoscopy - a method for 3D where other fails / Michael Cohn, Parameter AB

